(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年11月3日(03.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/103630 A1

(51) 国際特許分類7: G01D 21/00, G01M 15/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005931

(22) 国際出願日: 2004年4月23日(23.04.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ヒュー レットーパッカード デベロップメント カンパニー

エル. ピー. (HEWLETT-PACKARD DEVELOP-MENT COMPANY, L.P.) [US/US]; 77070 テキサス州 ヒューストン20555ステイトハイウェイ249 Texas (US).

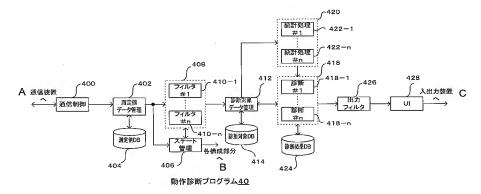
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三澤 正紀 (MIS-AWA, Masanori) [JP/JP]; 〒1688585 東京都杉並区高井 戸東3丁目29-21日本ヒューレット・パッカー ド内 Tokyo (JP). 石垣 伸哉 (ISHIGAKI, Shinya) [JP/JP]; 〒1688585 東京都杉並区高井戸東3丁目29-21 日本ヒューレット・パッカード内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: DIAGNOSTIC APPARATUS AND METHOD

(54) 発明の名称: 診断装置およびその方法



TO COMMUNICATION UNIT

TO EACH COMPONENT SECTION В

С TO I/O UNIT

OPERATION DIAGNOSTIC PROGRAM 40

400 COMMUNICATION CONTROL

402 MEASUREMENT DATA MANAGEMENT

404 MEASUREMENT DB

STATE MANAGEMENT 406

FILTER #1 410-1

410-n FILTER #n

DIAGNOSIS OBJECT DATA MANAGEMENT 412

DIAGNOSIS OBJECT DB 414

418-1 **DIAGNOSIS #1**

DIAGNOSIS #n 418-n

STATISTIC PROCESSING #1 STATISTIC PROCESSING #n 422-n

424 DIAGNOSIS RESULT DB

426 **OUTPUT FILTER** (57) Abstract: A diagnostic apparatus readily applicable to diagnosis of a small lot product. When measurement data on a measurement object is inputted sequentially, a filter section (408) performs filtering of the measurement data. When new measurement data is employed as diagnosis data, object a statistic processing section (420)updates diagnosis reference data using the new diagnosis object data. A diagnostic section (416) diagnoses the diagnosis object data based on the diagnosis reference data and judges whether an abnormality is present or not. If an abnormality is present, the fact is displayed to a user along with diagnosis results through an UI section (428).

(57) 要約: 少数生産品などの 診断に適用が容易な診断装 置などを提供する。測定対 象の測定値データが順次、 入力されると、フィルタ部 (408)は、測定値デー タをフィルタリングする。 新たな測定値データが、診

断対象データとして採用されたときには、統計処理部(420)は、新たな診断対象データを用いて、診断基準 データを更新する。診断部(416)

- (74) 代理人: 特許業務法人 アイ・ピー・エス (PATENT RELATED CORPORATION IPS); 〒2210052 神奈川県横浜市神奈川区栄町 5番地1横浜クリエーションスクエア 15階 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。